金属酸化物の識別に関する検証

塚原 学*, 五味 正光**, 鳥谷 淳*

概 要

電気火災としてトラッキング火災がよく知られているが、その他に亜酸化銅(Cu₂0)の生成に伴う発熱 現象が原因となる火災がある。現在、電気火災の鑑定では電気製品本体や配線の分析を行っているが、配 線やコンセントプラグに含まれる金属等の元素単体を識別することは比較的容易だが、化合物である金属 酸化物(亜酸化銅(Cu₂0)、酸化銅(Cu0)等)の識別は容易ではない。そこで、火災鑑定の効率性及び精 度をより向上させることを目的として、金属板(銅板、真鍮板)、コンセント(刃)及び電源コード(電 線)の加熱試料を作成し、保有する分析装置を用いて金属酸化物(Cu₂0、Cu0)の最適な分析手法について 検討を行った。

本検証結果から、X 線回折装置及びフーリエ変換赤外分光装置を用いて亜酸化銅(Cu₂0)の識別が可能で あることがわかった。今後、亜酸化銅(Cu₂0)の生成に伴う火災調査の原因究明において、本分析手法を 活用することができる。

1 はじめに

電気火災においては、コンセント刃に溜まった埃が原 因となるトラッキング火災がよく知られている。その他 に、亜酸化銅(Cu₂0)の生成に伴う発熱現象が原因とな る火災がある¹⁾。Cu₂0は数アンペアの電流で高熱を発生 させるため周囲の銅が溶けてさらに Cu₂0が増殖するこ ととなり、この現象は亜酸化銅の増殖発熱現象と呼ばれ ている²⁾。一般に、電源コード内部の電線は銅線が使用 されていることから、Cu₂0 は銅線において生成する可 能性があると考えられる。

2 検証の背景及び目的

電気火災が発生した場合には電気製品本体及び配線系 統等の鑑識を行い、更に必要がある場合には鑑定として 出火原因と考えられる部分の表面観察、熱分析及び元素 分析等を行っている。この際、配線やコンセントプラグ に含まれる金属等の元素単体を識別することは比較的容 易であるが、化合物である金属酸化物(Cu₂0、酸化銅 (Cu0)等)の識別は容易ではない。

そこで、火災鑑定の効率及び精度をより向上させるこ とを目的として、電源コード等を電気炉内で加熱するこ とにより Cu₂0 及び CuO を疑似的に作成し、保有する複 数の分析装置を使用して分析した。また、分析装置の組 み合わせによる金属酸化物の最適な分析手法について検 討を行った。

3 検証内容及び検証方法

本検証では、試料として銅板及び電源コード(内部の 銅線)を用いた。各試料を電気炉内で一定温度で一定時 間加熱したものを検証試料として使用し、実体顕微鏡に よる表面観察、金属顕微鏡による金属組織の観察、エネ ルギー分散型X線分析装置付走査電子顕微鏡(Scanning electron microscope with energy dispersion X-ray analyzer、以下「SEM-EDS」という。)による元素分析、 X線回折装置(X-ray diffractometer、以下「XRD」と いう。)による結晶構造解析、フーリエ変換赤外分光光 度計(Fourier transform infrared spectrophotometer、 以下「FT-IR」という。)による分子構造解析を行った。

- (1) 試料の作成
- ア 使用した試料

使用した銅板及び電源コードの仕様を次に示す。

(7) 銅板は JIS C1100 (タフピッチ銅 99.9 %以上)で、厚さ1 mmのものを使用した。

 (イ) 電源コードは、パナソニック株式会社(以下「P 社」という。) 製「型番 WHA28232WKP」及び朝日電器株 式会社(以下「E社」という。) 製「型番 LPT-302N」を 使用した。

イ 試料の加熱

各試料を電気炉内において 1050 ℃以下の所定の温度 でそれぞれ3時間加熱した。なお、電源コードの銅線は 被覆状態のまま加熱した。電気炉は東京硝子器械株式会 社製卓上型マッフル炉 F-120-SP を使用した。電気炉の

仕様を次に示す。

- ・炉内寸法:120×110×200 mm
- ·使用温度:最高 1100 ℃、常用 1000 ℃
- ・発熱体 : カンタル A-1 線
- ・電源:100 V
- ・制御方式: PID 制御方式
- (2) 実体顕微鏡及び金属顕微鏡による観察

加熱後の試料を実体顕微鏡で観察した。金属顕微鏡で 観察する前処理として試料をエポキシ樹脂で固定し樹脂 表面の研磨を行い、研磨後の試料について金属顕微鏡に て表面観察を行った。実体顕微鏡は写真1に示す Nikon 製 SMZ1500 を、金属顕微鏡は写真2に示す Nikon 製 ECLIPSE MA200 をそれぞれ使用した。



写真1 Nikon製 SMZ1500

写真 2 Nikon 製 ECLIPSE MA200

(3) SEM-EDS による元素マッピング

SEM は分解能が高く倍率の可変範囲が広いため、微細 な構造も肉眼で観察したように見ることができる顕微鏡 である。試料の組成像や凹凸像を SEM で観察し、試料か ら発生する特性 X 線を EDS で検出することにより元素分 析やマッピングを行うことが可能である。

装置は写真3に示す JEOL製 JSM-6390LAを使用 し、測定条件は次のとおり とした。

- ・加速電圧:20 kV
- · 試料雰囲気:高真空
- ・信号:SEI
- ·倍率:110倍~2000倍
- ・検出範囲:₅B (ホウ素)
- ~₉₂U(ウラン)
- (4) XRD による結晶構造解析

結晶構造の解明には X 線 回折法がよく用いられ、金 属、無機物、有機物などの 固体試料を分析することが 可能である。本検証では、 粉末 X 線回折法により、 Cu₂0 及び Cu0 の識別を試



写真 3 JEOL 製 JSM-6390LA



写真4 Rigaku製 MiniFlex600

みた。

装置は写真4に示す Rigaku 製 MiniFlex600 を使用し、 測定条件は次のとおりとした。

- ・測定角度範囲: 5~85 deg
- ・サンプリング幅:0.1 deg
- ・スキャンスピード:1 deg/s
- ・管電圧:40 kV
- ・管電流:15 mA
- (5) FT-IR による分子構造解析

FT-IR による分子構造解析は非破壊であり、真空下で 測定する必要もないため迅速性にも優れている。また、 文献によると銅表面酸化皮膜の IR スペクトルでは、 Cu₂0 と Cu0 の吸収位置が大きく異なり、Cu0 は 450~ 600 cm⁻¹の広い範囲に吸収が見られ、Cu₂0 は 620~625 cm⁻¹付近に吸収が見られることが報告されている^{31.41.51}。 このことから、本検証では FT-IR を使用した全反射法 (ATR)による分子構造解析を行い、金属酸化物の識別 が可能であるか検証した。

装置は写真5に示す Thermo Fisher SCIENTIFIC 製 Nichlet iS10 を使用し、測定条件は次のとおりとした。

- ・分解能:4 cm⁻¹
- ・スキャン回数:32回
- 測定方式:ATR
- ・プリズム:ダイヤモンド



写真 5 Thermo Fisher SCIENTIFIC 製 Nichlet iS10

4 検証結果及び考察

- (1) 実体顕微鏡及び金属顕微鏡による観察
- ア 銅板

銅板を 1050 ℃の電気炉内でそれぞれ 0.5 時間、1時間、1.5 時間及び2時間加熱後の試料断面の観察結果を 写真6及び写真7に示す。

(7) 実体顕微鏡による観察結果



写真6 1050℃で0.5時間加熱後の銅板断面

(イ) 金属顕微鏡による観察結果



(1050℃-2h) 写真7 1050℃で加熱した銅板断面

写真7の観察結果から、温度が 1050℃に達した直後 (0h)から銅板周辺に何らかの層が生成しているのが わかる。加熱時間が0.5時間、1時間、1.5時間、2時 間と増加するにつれ、この層の厚さが厚くなっているこ とから、加熱時間と層の生成度合いには相関関係がある といえる。銅板は 1041℃の電気炉内で加熱すると約 10 分間で0.1 mm程度の速度で酸化が進み Cu₂0 が生成され ることが報告されている⁰ことから、この層は Cu₂0 で ある可能性がある。

イ 電源コード

600℃の電気炉内でそれぞれ 0.5 時間、1時間及び5 時間加熱し被覆を剥いだ電源コードの銅線断面を観察し た。P 社製電源コードの実体顕微鏡による観察結果を写 真8に、金属顕微鏡による観察結果を写真9、写真 10 及び写真11に示す。

写真9から写真11において白く見える同心円上の部 分は銅線であり、加熱1時間で銅線周囲に何らかの層が 生成しているのがわかる。また、倍率を上げて拡大する と層中には色の異なる部分が観察される。加熱後の銅線 を常温まで冷まして確認したところ、銅線は脆く壊れ易 い構造となることが確認された。





(0.5時間加熱)

(1時間加熱)



(5時間加熱) 写真8 600℃で加熱した銅線断面





(×5倍)(×50倍)写真9 600°Cで0.5時間加熱した銅線断面





(×5倍)(×50倍)写真 10 600℃で1時間加熱した銅線断面





(×5倍)(×50倍)写真 11 600℃で5時間加熱した銅線断面

(2) SEM-EDS による元素マッピング

元素マッピングにより銅板及び電源コードの断面にお ける銅(Cu)及び酸素(0)元素の分布状態を調べた。 ア 銅板

加熱前及び 900 ℃で1 時間加熱後の銅板の元素マッ ピング結果を写真 12 及び写真 13 に示す。

写真12及び写真13の元素マッピング結果から、銅板

表面には Cu が分布しているのがわかり、加熱後の試料 は加熱前よりも表面に0の分布が増加してきていること から、銅の酸化物が生成していると考えられる。







(Cu 分布)



(0 分布)

写真14 電源コード断面のマッピング結果

(0分布)

写真 12 加熱していない銅板のマッピング結果







(Cu 分布)



(0 分布) 写真 15 拡大した電源コード断面のマッピング結果

(3) XRD による結晶構造解析

加熱後の各試料から採取した粉末を XRD にて測定した。 存在する可能性のある化合物をデータベースから検索し、 試料の回折ピークと化合物の回折ピークを比較参照した。 ア 銅板

銅の酸化物は加熱温度によって生成物の割合が変わる ことが報告されている⁰。銅板を1050 ℃以下の所定の 温度で3時間加熱した時に生成する酸化物を調べた。銅 板の加熱温度による酸化物の生成状況を表1に示す。

表1から、銅板は330 ℃~800 ℃においてCu₂0及びCu0 が生成し、900 ℃~1050 ℃においてCu₂0のみが生成した。 生成酸化物であるCu₂0に固有なピークを検出した例とし て1050 ℃で3時間加熱した時のXRD測定結果を図1に、 Cu₂0及びCu0に固有なピークを検出した例として500 ℃で 3時間加熱した時の測定結果を図2に示す。

イ 電源コード

(0分布)

600 ℃で 10 時間加熱した E 社製電源コード断面の元 素マッピング結果を写真 14 及び写真 15 に示す。

写真13 加熱した銅板のマッピング結果

写真 14 及び写真 15 から、電源コードの銅線周辺に生成した層は銅線と同様に Cu を含有していることがわかる。一方、0 の分布状態はよく観察できなかった。SEM では導電性がない試料は表面に帯電して像がぼやける場合があるため、スパッタリングにより炭素を薄くコーティングして表面に導電性を付与して再度観察を行ったが変化は見られなかった。

加熱温度(℃)	生成酸化物
1050	Cu ₂ 0
900	Cu ₂ O
800	Cu ₂ O CuO
700	Cu ₂ 0 Cu0
600	Cu ₂ 0 Cu0
500	Cu ₂ 0 Cu0
400	Cu ₂ O CuO
350	Cu ₂ 0 Cu0
340	Cu ₂ 0 Cu0
330	Cu ₂ 0 Cu0





図1 1050℃で3時間加熱時の XRD 測定結果





イ 電源コード

P 社製及び E 社製の電源コードについて、それぞれ 1050 ℃以下の所定の温度で3時間加熱した時に生成す る酸化物を調べた。

(7) P 社製

加熱温度による酸化物の生成状況を表2に示す。

表 2 から、350℃~1050 ℃において Cu₂0 及び Cu0 が 生成した。生成酸化物である Cu₂0 及び Cu0 に特有なピ ークを検出した例として 500 ℃で 3 時間加熱した時の XRD 測定結果を図 3 に示す。

衣(「 社殺电源 」 ― トに わけ る 生 成 酸 化

加熱温度(℃)	生成酸化物
1050	Cu ₂ 0 Cu0
900	Cu ₂ 0 Cu0
800	Cu ₂ 0 Cu0
700	Cu ₂ 0 Cu0
600	Cu ₂ O CuO
500	Cu ₂ 0 Cu0
400	Cu ₂ 0 Cu0
350	Cu ₂ 0 Cu0



図3 500℃で3時間加熱時の XRD 測定結果

(イ) E 社製

加熱温度による酸化物の生成状況を表3に示す。

表3から、生成酸化物である Cu₂0 に特有なピークを 検出した例として 1050 ℃で3時間加熱した時の XRD 測 定結果を図4に、Cu₂0 及び Cu0 に特有なピークを検出 した例として 500 ℃で3時間加熱した時の XRD 測定結 果を図5に示す。

電源コードはP社及びE社どちらの製品についても、 350 ℃~1050 ℃の加熱温度において、銅線周囲からCu₂0 が検出された。金属顕微鏡で観察された銅板表面及び銅 線周囲に生成した何らかの層は、XRD測定結果からCu0及 びCu₂0であると考えられる。Cu0は酸素充分な反応により 生成し、Cu₂0は酸素不充分な反応により生成することか ら、大気に接している銅線周囲の層はCu0であり、層中の 部分はCu₂0であると考えられる。

なお、コンセントプラグの差し刃と受け刃には真鍮 (Cu と亜鉛 (Zn) の合金)が使用されており Cu を含有 していることから、プラグの刃においても Cu₂O が生成 する可能性が考えられる。しかしながら、真鍮板 (JIS C2801: Cu 60 %、Zn 40 %)及び真鍮製プラグの差し刃 (P 社製:型番 WH4415P、E 社製:型番 A-22H)に対して も本試料と同様の実験を行い分析したが、Cu₂O は検出 されなかった。

加熱温度(°C)	生成酸化物
1050	Cu ₂ 0
900	Cu ₂ 0 Cu0
800	Cu ₂ 0 Cu0
700	Cu ₂ 0 Cu0
600	Cu ₂ 0 Cu0
500	Cu ₂ 0 Cu0
400	Cu ₂ 0 Cu0
350	Cu ₂ 0 Cu0

表3 E 社製電源コードにおける生成酸化物



図4 1050℃で3時間加熱時の XRD 測定結果



図5 500℃で3時間加熱時の XRD 測定結果

(5) FT-IR による分子構造解析

加熱後の銅板及び電源コードの周囲に生成した層から 粉末を採取し、FT-IR にて測定した。

ア 銅板

XRD 測定結果から、Cu₂0 が生成した 1050 ℃、Cu₂0 及 びCu0 が生成した 350 ℃で3 時間加熱した試料につい てそれぞれ FT-IR 測定を行った。測定結果を図6 に示す。



イ 電源コード

(7) P 社製

XRD 測定結果から、Cu₂0 及び Cu0 が生成した 1050 ℃ で3時間加熱した試料について FT-IR 測定を行った。測 定結果を図7に示す。



(イ) E 社製

XRD 測定結果から、Cu₂0 が生成した 1050 ℃、Cu₂0 及び Cu0 が生成した 600 ℃で3時間加熱した試料についてそれぞれ FT-IR 測定を行った。測定結果を図8に示す。Cu0 の FT-IR スペクトルは 450~600 cm⁻¹ の範囲に特有の吸収が見られ、Cu₂0 は 620~625 cm⁻¹付近に特有の吸収が見られることが報告されている^{3).4).5)}。図6、図7及び図8の測定結果から、450~600 cm⁻¹の範囲には明確なピークが見られず、また低波数側ではノイズが大

きいため Cu0 の有無を識別することができなかった。一方、620~625 cm⁻¹ 付近ではいずれの試料においてもピークが現れることから、銅板及び電源コードにおける Cu₂0 の存在が確認できた。



図8 E社製電源コードの FT-IR 測定結果

5 おわりに

保有する分析装置を用いて金属酸化物(Cu₂0、Cu0)の分析手法について検討を行った結果を以下に示す。

- (1) 結晶構造の違いから、XRD により Cu₂0 及び Cu0 の 識別が可能であった。また、試料に両方が混在してい てもそれぞれの識別が可能であった。
- (2) FT-IRでは、620~625 cm⁻¹に特有の赤外線吸収スペクトルを示す Cu₂0の識別は可能であったが、450~600 cm⁻¹に特有の吸収スペクトルを示す Cu0 は特定することが難しく識別することはできなかった。
- (3) SEM-EDS による元素マッピングでは、Cu0 及び Cu₂0 の金属酸化物を識別することはできなかった。しかし、 XRD 及び FT-IR による分析と併用すれば、結晶構造や 分子構造とともに試料表面の金属元素の分布状態が観 察できることから、より精度の高い分析結果を求める 上で活用可能である。

今後、Cu₂0の生成に伴う火災調査の原因究明において、本分析手法を活用することができる。

[参考文献]

1) 電源接続部の接触部過熱から出火に至るメカニズムに関す る研究委託報告書、日本大学理工学部理工学研究所、pp.110-116、平成18年3月

- 2) 堀田悦彦: 亜酸化銅増殖発熱現象について、火災、pp. 52-58、1975
- 3) G.W.Poling: Infrared Reflection Studies of the

Oxidation of Copper and Iron, Solid State Science, Vol. 116, pp. 958-963, 1969

- 4) 重松聖二:金属の酸化反応における量的関係の指導法の検
- 討、愛媛県総合教育センター理科研究室平成19年度研究紀要、
- pp. 40-43、2007
- 5) 大脇武史:FT-IRによる銅表面酸化第一銅(Cu₂0)の定量解析、

神戸製鋼技報、Vol. 52、No. 2、pp. 71-73、2002

Study on the Identification of Metal Oxides

Manabu TSUKAHARA*, Masamitsu GOMI**, Sunao TORIYA*

Abstract

Arc tracking fires are well known as electrical fires. Other electrical fires are caused by the exothermic reaction with the formation of cuprous oxide (Cu_20) . We currently analyze electrical appliances and their wires in the appraisals of electrical fires. Although it is comparatively easy to identify single elements such as metals contained in electrical wires and plugs, identifying chemical compounds such as metal oxides-including cuprous oxide (Cu_20) and cupric oxide (Cu0)-is not easy. We prepared the samples of copper and brass plates, electrical plugs and wires after heating, and verified the optimum methods for analyzing Cu_20 and Cu0 by using analytical instruments we possess, with the aim of improving the efficiency and precision of our appraisals.

In this study, we found that it is possible to identify Cu_20 by using X-ray diffractometer and Fourier transform infrared spectrometer. This method will be useful for fire investigations related to the generation of Cu_20 .

*Hazardous Materials Identification Section **Yotsuya Fire Station